フッ酸を用いないニオブ電解研磨法の探索(2)

SEARCH OF NIOBIUM ELECTROPOLISHING METHOD WITHOUT HYDROFLUORIC ACID (2)

仁井 啓介#,A),井田 義明A),文珠四郎 秀昭B),八代 仁C),白取 凌C) Keisuke Nii ^{#, A)}, Yoshiaki Ida^{A)}, Hideaki Monjushiro^{B)}, Hitoshi Yashiro^{C)}, Ryo Shiratori^{C)} ^{A)} Marui Galvanizing Co., Ltd. ^{B)} High Energy Accelerator Research Organization (KEK) ^{C)} Iwate University

Abstract

Marui Galvanizing Co. Ltd., KEK, and Iwate University are conducting research and development of highly safe niobium electropolishing (EP) solutions and EP methods that replace conventional concentrated sulfuric acid and hydrofluoric acid. We have reported the results of direct current EP using methanesulfonic acid and ammonium fluoride and EP using pulse inversion voltage. This time, we conducted DC EP using acids other than methanesulfonic acid, and pulse inversion voltage EP experiments using the three-electrode method. In direct current EP, niobium polishing was confirmed in direct current EP using glycolic acid. With the pulse inversion voltage EP, the pulse shape, the polishing amount, and the polishing state were evaluated after the niobium potential was determined by the three-electrode method.

はじめに 1.

International linear collider (ILC) の誘致、建設を進め るためには、コストダウンが非常に重要となる。特に約 8000 本必要となるニオブ加速空洞の製造コストダウンが 重要視されている。ニオブ加速空洞は性能向上のため 内面に電解研磨(EP)処理が施される。現在は濃硫酸 (98%)とフッ酸(45~55%)の混合液(体積比9:1)が使わ れているが、これらの薬品は毒物、劇物に指定されてお り人体に対して有害であること、腐食性が高いため EP 装 置にテフロン等の高価な材料を使用する必要があること、 使用や廃棄のための安全対策コストが高くなること、など が問題となっている。安全性の向上や製造のコストダウ ンのためこれらの薬品を使用しないニオブ EP 法の確立 が望まれている。

マルイ鍍金では KEK、岩手大学と共同でフッ酸を使 用しないニオブ EP 法の開発を行っており、これまでにメ タンスルホン酸とフッ化アンモニウムを用いた EP やパル ス反転電圧を用いた EP(パルス EP)の研磨検証実験結 果を報告した[1]。今回、グリコール酸を用いた EP 実験と、 三電極法を用いたパルス EP のカソード、アノード電位依 存性を確認したので報告する。

フッ酸代替薬品によるニオブの EP 2.

ニオブ EP のための濃硫酸、フッ酸代替薬品としては、 これまでにメタンスルホン酸(CH3SO3H)+フッ化水素アン モニウム(NH4HF)を用いた実験を行った。その結果、IV 特性でプラトー領域が見られ、研磨表面の粗さや光沢の 改善も見られたが、研磨レートがやや遅いという結果で あった[1,2]。今回はこれらに変えてグリコール酸 (C₂H₄O₃)と酸性フッ化アンモニウム(NH₄F・HF)を用い たニオブ電解研磨の確認を行った。実験条件を表 1 に 示す。また、実験に用いた薬品、電極等を図1に示す。

.. .

Table 1: Conditions This EP			
パラメータ	条件		
EP 液	70wt%グリコール酸水溶液		
	300 mL		
	+酸性フッ化水素アンモニウム		
	15 g		
アノード	ニオブ試験片(1.4×1.2 cm)		
カソード	ニオブ板(3.2×3.2 cm)		
EP 電圧	15 V, 25 V		
EP 液温度	~5 °C, ~20 °C, ~50 °C		
EP 時間	30m、1h、1.5h		

30m, 1h, 1.5h



化学式:NH₄F·HF

Figure 1: Photos and Schematic of setup, electrolyte, electrode, state of experiment.

[#] keisuke nii@e-marui.jp

EP を実施するにあたって、はじめに IV 特性の測定を 行った。各条件での IV 特性の結果を図 2 に示す(縦軸 はグラフ形状が見やすいように各々異なっているので注 意)。



Figure 2: IV curves of each condition.

IV 特性は、従来の濃硫酸+フッ酸 EP 液での特性と類 似しており、いずれの条件においても 7~10V 以上でプ ラトー領域(研磨領域)が現れている。これにより、本 EP 液でも従来液と同様に EP が進むと考えられる。

EP 時の研磨時間、電流密度、研磨量、研磨レートを 図 3 に示す。~20 ℃(常温)での研磨レートは従来 EP 液(0.32 µm/min)とほぼ同様であった。、また温度が高い ほど、電圧が高いほど電流密度が大きくなり、研磨レート も大きくなる傾向も従来液と同様に見られた。特に温度 が 50℃になると研磨レートが極端に大きくなっている。

	高温(~50°C)	常温(~20℃)	低温(~5℃)
電圧 15V	研磨時間:30min 電流密度:~100mA/cm ² 研磨量:38.9µm 研磨レート:1.30µm/min	研磨時間:1hour 電流密度:~20mA/cm ² 研磨量:12.8µm 研磨レート:0.21µm/min	研磨時間:1.5hour 電流密度:~10mA/cm ² 研磨量:12.8µm 研磨レート:0.14µm/min
電圧 25V	研磨時間:30min 電流密度:~150mA/cm ² 研磨量:60.1µm 研磨レート:2.00µm/min	研磨時間:1hour 電流密度:~35mA/cm ² 研磨量:25.7µm 研磨レート:0.43µm/min	研磨時間:1.5hour 電流密度:~12mA/cm ² 研磨量:15.2µm 研磨レート:0.17µm/min

Figure 3: EP time, current density, removal thickness and removal rate of each condition.

研磨後の外観表面とSEM 観察(×500)の結果を図4、 図5にそれぞれに示す。全体的に高温、高電圧のほうが 表面の光沢が増加する傾向が見られたが、従来液を 使った時ほどの光沢は出ていなかった。表面 SEM 観察 では、全体的に細かい凹凸の模様が見られたが、高温、 高電圧ではやや改善されていた。尚、従来液で EP した 表面に見られる結晶粒の模様は見られなかった。

今回実験した EP 液、EP 条件ではニオブ研磨の進行 は確認できたが、従来 EP ほどの研磨品質は得られな かった。今後は液の組成依存性や添加物のなどの確認 を行い、研磨品質の向上を目指すとともに、他の薬品の 可能性も積極的に探っていく。



Figure 4: Surface inspection results of each condition.



Figure 5: SEM images of each condition.

3. パルス反転電圧によるニオブの EP

フッ酸を用いないニオブの EP としては、パルス反転電 圧を使用する方法のテストをこれまでに行った。そこでは 対極材料やアノード、カソード電位に対する電荷量の確 認などを二極法で行った[1,2]。

そこで今回はニオブの電解研磨挙動を詳細に検討す るため、三電極法を用いて研磨が進行するためのパルス 電位条件を確認した[3]。実験のセットアップとパルス反 転電圧の形状を図6、図7にそれぞれに示す。研磨面積 は約1.1 cm²、対極はPt被覆Ti、EP液は30wt%硫酸、 参照電極は Ag/AgCl/KCl(sat.)を用いた。パルス幅はア ノード、カソードも2msで固定し、0Vの休止時間1ms を入れた。



Figure 6: Schematic view of pulse EP setup.



Figure 7: Schematic view of shape.

アノード電位(Ea)を0~+6V、カソード電位(Ec)を-6~ 0Vで変化させた場合のアノード、カソード電流の波形と 電荷量、研磨量の確認を行った。波形の例として、Ea = 3VでEcを変化させた波形を図8、Ea=5Vの場合を図 9に示す。



Figure 9: Pulse shape at Ea = 5 V.

いずれの場合においても、カソード電位を変化させる ことにより、アノード電流波形が変化していることがわかる。 カソード電位が大きくなると、アノード電流ピークの幅が 大きくなるとともにカソード電流が増加する傾向がある。 また、アノード電位が大きくなると、カソード電位によりア ノード電流ピークの幅が変化するが、カソード電流は変 化しない。これらの波形より、各電位条件でのアノード電 荷量、カソード電荷量、研磨量(重量減少量)をまとめた グラフを図 10 に示す。また、各条件で研磨したサンプル の表面 SEM 観察結果を図 11 に示す。



Figure 10: Pulse potential vs charge and removal rate (Left: Cathode charge, Right: Anode charge).



Figure 11: SEM images of each cathode and anode potential.

まずカソード電位の影響については、カソード電位が 大きくなるにしたがってカソード電荷量も増大するが、ア ノード電荷量の変化は小さく、カソード電位が大きくなる

にしたがって大きくなるが、-4 V 付近で飽和している。研 磨レートについては、アノード電位 0 V 以外はカソード電 位が大きくなるほど研磨レートが大きくなっている。アノー ド電位の影響については、アノード電位が+2 V 以上では アノード電荷量にはほぼ影響せず(ピークの形状には影 響している)、カソード電荷量にもほぼ影響しない。研磨 レートも+2 V 以上でほぼ一定となっていた。研磨の進行 については、アノード電流が表面の酸化膜の形成、カ ソード電流が酸化膜の除去にかかわっていると考えられ ているが、今回はこれを裏付けるような結果となった。

研磨後の表面状態は、カソード電位+1~+2Vではほ とんど研磨が進んでいない状態で初期状態(アノード、 カソードとも0V)から大きく変化していない。それ以外の 条件では、大きさや形状に多少差があるものの、ほぼす べてにおいて気泡跡のような丸い凹凸が見られており、 表面は平坦にはなっていない。また、従来液でのEPの 時のような結晶粒も見られていない。外観でも光沢が出 ていないため、表面状態については改善が必要である。

その他のパラメータとしてはアノード、カソードパルス 幅の研磨状態に及ぼす影響の評価なども行っている[3, 4]。今後は、表面の平坦化、光沢化を目指してさらに条 件、波形などの確認を行うとともに、大きな面積の研磨を 行った場合の効果を確認する予定である。

4. まとめ

従来の濃硫酸+フッ酸に代わる、フッ酸を使用しない ニオブ EP 液、EP 手法開発のための実験を行った。今回 は代替薬品としてグリコール酸+酸性フッ化水素アンモニ ウム液を用いた EP と三電極法にてパルス反転電圧を用 いた EP を行った。

グリコール酸+酸性フッ化水素アンモニウムを用いた EPでは、従来 EP液と同様の IV 特性が得られ、従来液 と同等の研磨レートも得られたが、表面がやや粗く、従来 通りの光沢が得られなかった。

三電極法でのパルス反転電圧を用いた EP では、カ ソード、アノード電位を変えた時のカソード、アノード電荷 量と研磨レートを確認した。表面は気泡跡のようなものが 見られ、平坦にはならず光沢はでていなかった。

今後は、良好な研磨後表面や研磨レートを得るため の条件出し、他の薬品や電圧波形等の検討などを行う。 また、今回はすべてニオブ小片での実験であったが、さ らに大きな形状のニオブを用いた実験やニオブ単セル 空洞での EP 実験を行っていきたい。

参考文献

- [1] 仁井啓介他, "フッ酸を用いないニオブ電解研磨法の探索" 第 14 回日本加速器学会年会、札幌市 2017 TUP038.
- [2] 川村翔磨氏修士論文, "ILC 用ニオブ加速空洞の電解研 磨に関する研究" 平成 28 年度 岩手大学大学院 工学研 究科 応用化学・生命工学専攻.
- [3] 白取凌氏修士論文, "ILC に向けたニオブ加速空洞の電解 研磨技術開発"平成 30 年度 岩手大学大学院 総合科学 研究科 理工学専攻 物質化学コース.
- [4] 八代仁他, "パルス電位制御による硫酸溶液中におけるニ オブの電解研磨"材料と環境, 68, 148-151 (2019).